



東証スタンダード 6721

# *Wintest Corp.* CORPORATE PROFILE



## *Continue to Challenge*

先端デバイス検査を常にリードする

<https://www.wintest.co.jp/>

# 会社概要

会社名	ウインテスト株式会社
代表者	代表取締役 姜 輝
上 場	東証スタンダード 6721
所在地	神奈川県横浜市西区平沼1-2-24
事業所	大阪府大阪市北区長柄中3-13-10
設 立	1993年8月
資本金	16.27億円（2023年12月31日現在）
従業員数	96人
関連会社	偉恩測試技術(武漢)有限公司(ウインテスト武漢)
事業内容	半導体自動検査装置開発・製造・販売・サポート

## Mission・Vision・Value

### ◎ Mission（我々の使命、存在意義）

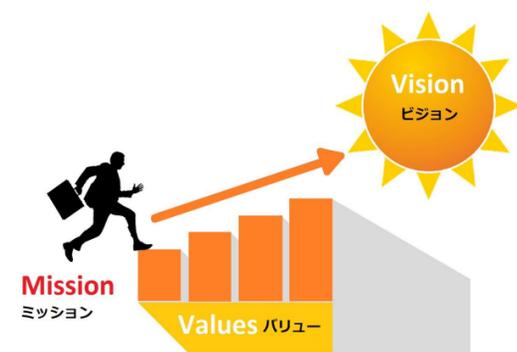
半導体の自動検査技術で人々の豊かな生活と幸せ、社会の発展に貢献します。

### ◎ VISION（我々の将来のありたい姿）

人とデジタルを繋ぐ主要インターフェースである「ディスプレイと周辺デバイス」、そして電子の目「イメージセンサー」を始めとする半導体の自動検査における、トップリーダーを目指し、世界的企業へと成長します。

### ◎ VALUE（我々の大事に思うもの）

- ① 顧客満足を第一にします。
- ② 自分の事業領域に、常に創造・挑戦し、No.1を目指します。
- ③ 高い製品品質と持続的な改善を通じ顧客に貢献します。
- ④ PDCAを速く回し、スピード感を持って、目標を達成します。
- ⑤ 仕事を通じ、豊かでいきがいのある人生を構築します。



## ESGを通じたSDGsへの取り組み



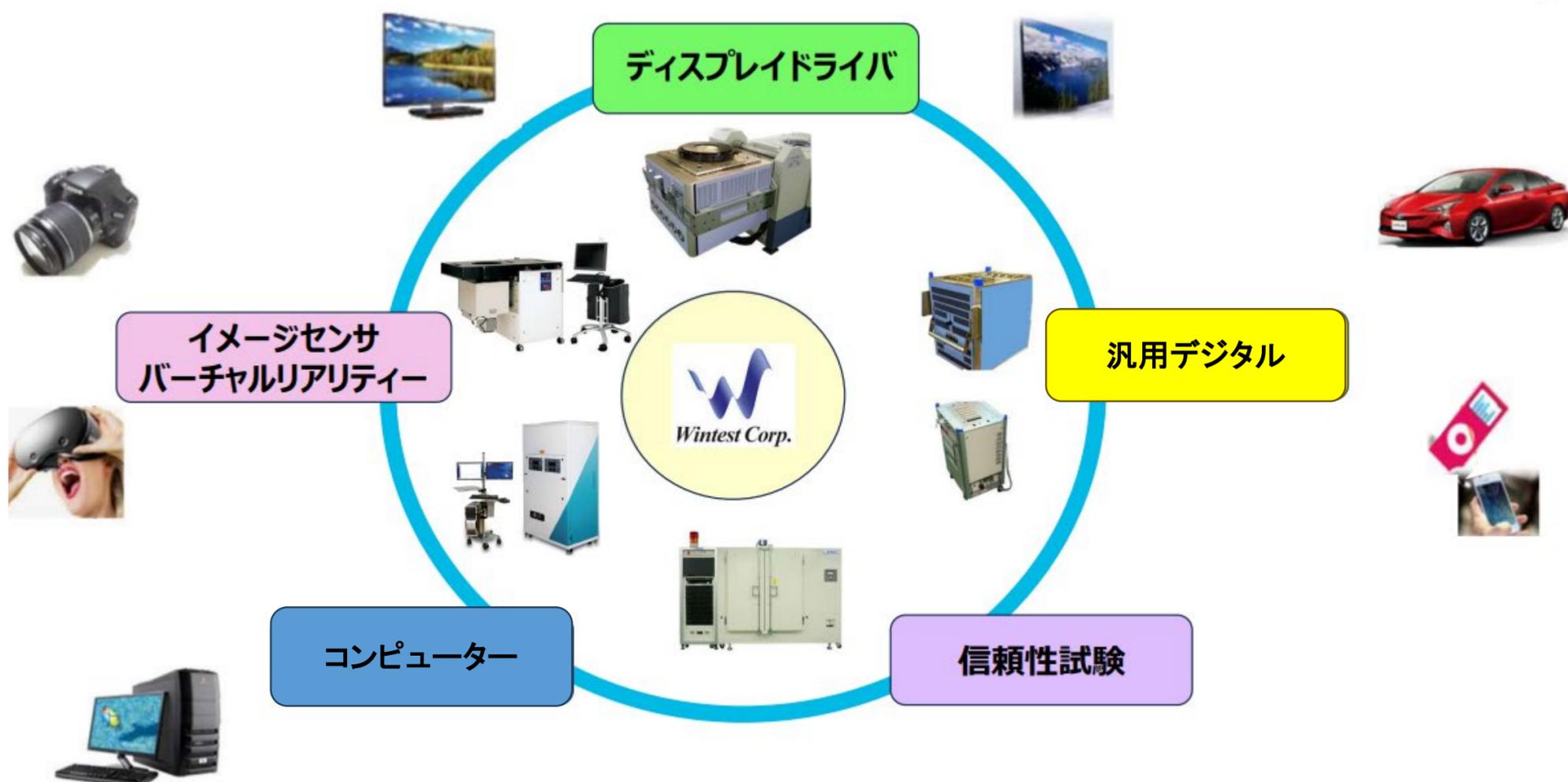
当社は、当社の検査装置開発において、多くのエネルギーを必要とする装置の構造や構成をひとつずつ見直し、業界最低消費電力を達成、冗長な機能の削減に取り組むことで、我が国ひいては地球規模の社会・経済全体のサステナビリティ課題への積極的・能動的な貢献が重要であるとの認識の下に、経営資源、開発資源を駆使し、低炭素社会実現に貢献していくべきだと考えて実行しています。

# ウインテスト株式会社の主事業

当社は、最先端半導体デバイスの検査装置メーカーです。

フラットパネルディスプレイの駆動用ICの検査、撮像素子(イメージセンサ)の検査を主軸に半導体製造工程で使用される、自動検査装置の開発、設計、販売並びに技術サポートをしています。

当社の装置で検査された半導体が組み込まれた最終製品は、スマホ、テレビ、PCなど皆様の周りにはたくさんあります。



## 沿革

- 1993年08月 ウインテスト株式会社設立
- 1995年07月 検査装置初号機LCD/CCD/CIS Tester WTS-103C販売開始
- 2003年09月 東京証券取引所マザーズ市場上場
- 2003年09月 LCD/OLED/CCD/CIS Tester WTS-311販売開始
- 2009年12月 Display Driver IC Tester WTS-577販売開始
- 2019年03月 大阪事業所設立
- 2019年12月 子会社ウインテスト武漢設立
- 2022年04月 東京証券取引所スタンダード市場変更

# 当社の半導体検査装置の役割

当社の検査装置は、検査対象のICチップ(半導体)にチップを動作させるための電源と信号を供給し、ICチップから出力された信号を基準データ(お手本)と比較し、欠陥のあるチップを判別します。  
いろいろな半導体があり、その種類に応じて最適な検査装置が用意されています。

## 弊社の半導体検査装置製造ライン



## 検査装置開発の歴史



# 当社の新製品紹介

## Display Driver IC検査装置

### WTS-577SX



高速ボード駆動周波数4.0Gbps  
I/Oボード駆動周波数1.6Gbps  
Perpin Digitizer 2304ch  
WTS-577SRの後継モデル  
空冷方式

### WTS-9000



高速ボード駆動周波数は4.5Gbps  
I/Oボード駆動周波数1.6Gbps  
Perpin Digitizer 3584ch  
ウインテストのフラグシップモデル  
水冷方式

# 半導体検査装置ラインナップ

## Display Driver IC 研究開発用検査装置

### WTS-588D



WTS-9000コンパクトモデル  
研究開発用  
空冷方式

## LCD/LCOS/OLED Array CCD/CIS検査装置

### WTS-311NX



一眼レフカメラ大判センサ測定用  
同測4個まで対応  
アナログ・デジタル出力対応  
最大3億8千万画素一括取り込み

## ロジックIC検査装置

### WTS-3000/WTS-677/WTS-577L



テスターインテストヘッド構成  
高速、省スペース、省エネ  
リニアデバイスIC検査対応  
汎用ロジックIC検査に特化

## アナログ・ミクスドシグナルIC検査装置

### WTS-750/800



電源デバイス/IPM  
高電圧(2000V)、大電流(300A)  
アナログ/デジタル混在ICに対応  
非同期(ASync)機能対応  
異品種同時測定

## 小型CMOSイメージセンサー検査装置

### WTS-377



デジタルカメラ、携帯電話、車載  
CMOSイメージセンサー測定用  
最大64個同時測定対応  
デジタル出力対応  
最大3億8千万画素一括取込

## 品質保証部門用バーニン



モニターバーニンBI-Mシリーズ  
ダイナミックバーニンBI-D  
テストバーニンBI-Tシリーズ  
QAT(品証向)モニターバーニン  
各種ロジック・アナログ、メモリー  
ASIC(-55度)対応可能

# 国内・海外拠点

拠点	研究開発	製造	サービス	応用技術	販売
横浜本社	●		●	●	●
大阪事業所	●	●	●	●	●
偉恩測試技術(武漢)	●	●	●	●	●
蘇州営業所			●	●	●
台湾出張所			●		●



<https://www.wintest.co.jp/>  
〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼一丁目2番24号  
TEL: 045-317-7888 FAX: 045-317-9255